

教育訓練與專業認證目錄

2025 年版本





加快學習速度。 驗證自身技能。 透過工程創造更多 可能性。

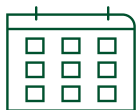
NI擁有技術專家提供的豐富學習資源，旗下產品與服務適用於任何產業或應用領域，確保您順利成功。探索NI的教育訓練與專業認證服務，並立即開始您的學習旅程。

- 04 學習途徑
- 16 購買選項
- 18 學習形式
- 20 教育服務課程
- 24 勳章與專業認證
- 28 NI 全球服務與支援



不論是剛接觸 NI 產品，還是已使用 NI 產品多年的人，成功的關鍵在於能在需要時取得正確的學習資源。NI 提供全方位的教育服務，可協助您改善現有應用，並在您職涯的各個階段提供支援。

此方案可有效提升產能、縮短開發時間，並讓您更能透過 NI 產品打造出可維護的穩定應用。此外，還可以根據個人的時間安排量身打造課程內容，讓初學者和專家都能掌握核心技能。



超過 40 年的教育服務經驗



90% 的客戶滿意度



92% 的客戶推薦我們的課程

資料來源：全球課程意見調查 (2021 年 1 月至 9 月)。

按照自己的方式學習。 找到自己的成功之道。

若要透過 NI 工具提升生產力，則必須先明確規劃目標與應用領域。接著您可以與 NI 一起找出最佳策略來取得並驗證技能，以提升您的生產力。

學習途徑可協助您瀏覽應用領域的可用學習資源。在每個學習途徑中，您都可以運用評估功能，找出成功開發應用所需的學習內容。

選擇自選課程與主題、偏好的學習形式以及使用教材的頻率，即可根據自己的需求客製化學習途徑。

開發 NI LABVIEW 應用

學習在 LabVIEW 圖形化程式設計環境中開發基本應用，或是在單一或多位開發人員環境中建構大型應用。

嵌入式量測、控制與監控

了解如何使用 LabVIEW Real-Time、LabVIEW FPGA 與 NI 的可客製化現成可用硬體，迅速設計、進行原型製作並部署嵌入式控制與監控系統。

開發自動化量產測試系統

了解如何於 NI TestStand 環境中開發並管理測試應用、將之發布至測試站、針對硬體與受測裝置建立測試程式碼，並將測試結果記錄至資料庫。

開發硬體迴路測試系統

使用 NI VeriStand 或 HIL and Real-Time Test Software Suite 開發即時測試系統，並建立可在執行階段進行編輯的使用者介面。

電腦架構的資料擷取與資料記錄

掌握相關技巧以設定DAQ硬體、執行精確的單點與連續量測，並同步化資料擷取作業。

安裝、設定與控制 NI 模組化儀器

了解儀器的完整測試工作流程，包含設定、接線、控制、校準、除錯以及最佳化的速度與精確度。

使用 NI DIADEM 管理資料

了解如何以圖形方式檢視資料、自動產生報表，並擴充 DIAdem 的功能。

半導體測試系統課程

了解如何使用NI半導體測試系統(STS)，針對混合訊號與RF裝置開發設定架構的測試程式，並進行除錯、建立客製化量測以及最佳化進階測試程式。

使用 NI SYSTEMLINK™ 軟體管理系統與資料

SystemLink™ Server或SystemLink™ Enterprise可管理測試系統、部署軟體、管理硬體資產，以及收集並分析測試結果。

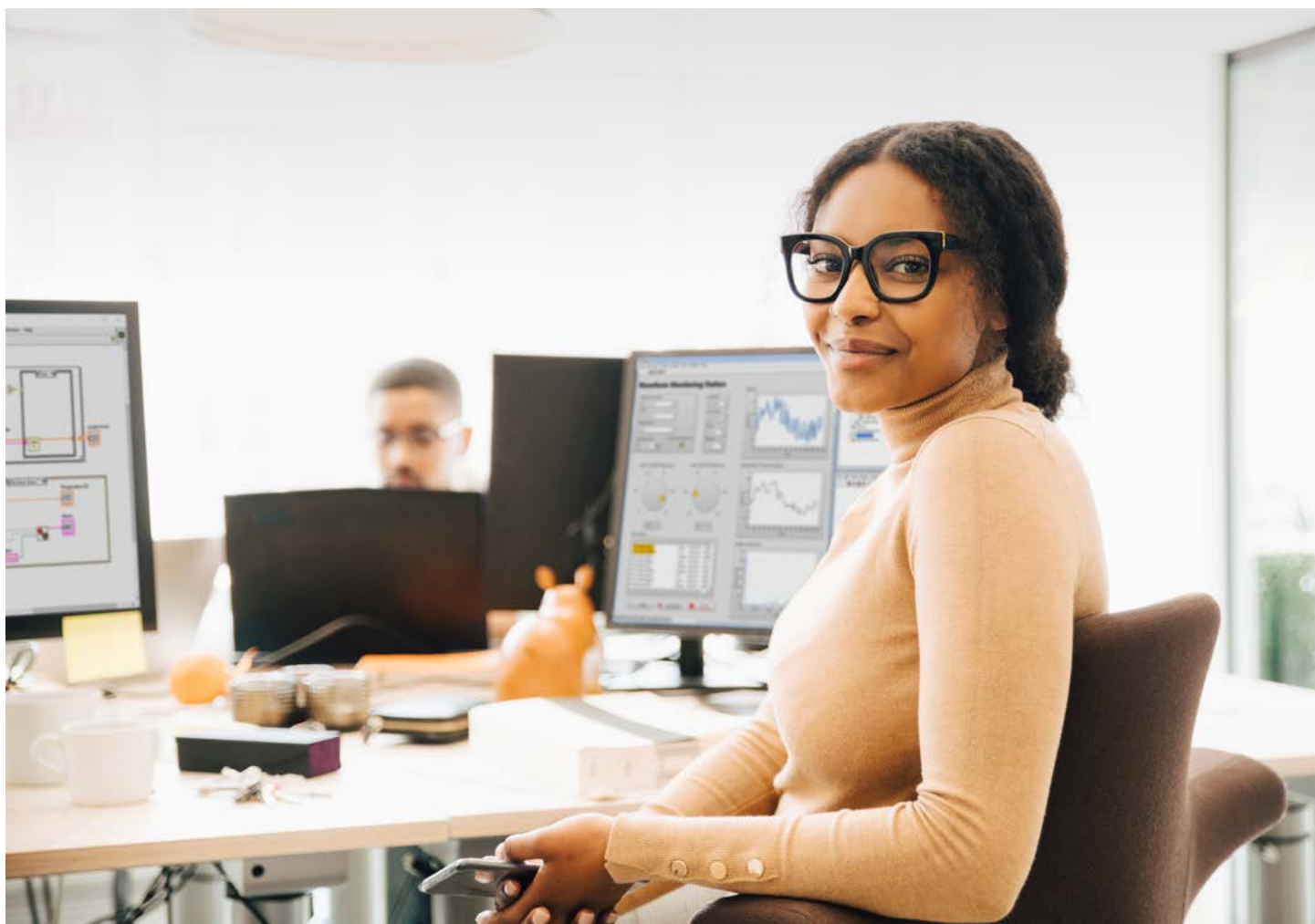
NI OPTIMALPLUS 解決方案

探索 OptimalPlus 解決方案與巨量資料分析的強大威力，以提升良率與生產力。

常見的學習途徑

透過下列客製化的學習途徑，找到教育訓練課程、專業認證測驗與專業能力活動，以滿足您的應用需求。這些途徑是根據建議的技能水平，以及此應用人員可能感興趣的其他領域而開發。

透過學習途徑右側的說明，即可了解目前的進度。請注意，我們的許多課程均提供講師授課與隨選兩種形式。每個途徑的最後都包含了可選的課程、測驗、活動和評估，讓您隨時可以根據自己的需求來客製化學習內容。



開發 LabVIEW 應用

透過 LabVIEW 加快學習速度並提高生產力，進而縮短開發時間並降低開發成本。此學習途徑適用於使用 LabVIEW 開發應用的工程師，同時提供相關課程、測驗與活動，可協助使用者從 LabVIEW 圖形化程式設計環境中，開發基本應用到單一或多個開發人員設定的大型應用架構。探索其中建議的不同技巧，以成功開發可隨著專案發展而調整的應用。

快速入門

使用 LabVIEW 開發、支援或除錯小型至中型應用的技術人員或基礎開發人員，可學習套用基本的設計樣式並對 LabVIEW 程式碼進行除錯。

01

LabVIEW 核心課程 1
+
LabVIEW 核心課程 2
+
CLAD 測驗

透過實際操作方式，了解 LabVIEW 環境、資料流程式設計與常見的 LabVIEW 開發技術。

使用 LabVIEW 設計、建置與分配獨立式應用，並套用單迴路與多迴路的设计樣式以發揮應用功能。

通過 LabVIEW 基礎認證 (CLAD) 即代表具備 LabVIEW 環境的實作知識，具備編碼與說明文件最佳實務的基礎概念，同時能了解與解譯現有程式碼。

必須搭配 1 個以上的流程設計並開發中型至大型應用的軟體工程師，將學會評估檔案格式、建立可執行檔、處理執行期間的錯誤，並根據使用者需求進行設計。

02

LabVIEW 核心課程 3
+
CLD 測驗

了解架構完整的最佳實務，以設計、建置、記錄並測試 LabVIEW 應用。

LabVIEW 進階認證測驗將驗證設計與開發功能性程式的能力，同時透過適當的說明文件與樣式，盡可能縮短開發時間並確保可維護性。

設計應用架構的軟體架構工程師或擔任大型應用的技術主管或專案經理，都可以學會如何運用合適的工具與技術來管理開發作業，設計、開發並記錄清楚的 API，以及分析 LabVIEW 應用的架構以便加以改善。

03

適用於測試應用的軟體工程
+
CLA 測驗¹

了解管理大型團隊導向應用開發專案的常見實務。

最高階的 LabVIEW 專業認證，代表其已精通 LabVIEW 應用的架構與專案管理能力。

¹CLA 測驗需要有效的 CLD 才能參加。

其他選項

[LabVIEW 網路連結 \(LabVIEW Connectivity\)](#)

[LabVIEW 互通性](#)

[LabVIEW 中的物件導向設計與程式設計](#)

[LabVIEW 的行動元件導向設計](#)

勳章評估

[LabVIEW 程式設計](#)

[LabVIEW 應用開發](#)

嵌入式量測、控制與監控

此學習途徑適用於開發嵌入式監控系統的使用者。當中提供相關課程、測驗與活動，讓您了解如何使用 LabVIEW 設計、進行原型製作並部署穩定且精確的嵌入式系統。如果您正在使用 Embedded Control and Monitoring Software Suite、LabVIEW Real-Time Module 或 LabVIEW FPGA Module 搭配 NI CompactRIO、單卡式 RIO、PXI 或 R 系列多功能可重設 I/O 介面卡，請考慮採用此途徑。

快速入門

針對嵌入式控制與監控應用的設計、原型製作與部署作業，LabVIEW 核心課程將介紹 LabVIEW 環境、通訊機制與開發技巧。

01

LabVIEW 核心課程 1
+
LabVIEW 核心課程 2
+
CLAD 測驗

透過實際操作方式，了解 LabVIEW 環境、資料流程式設計與常見的 LabVIEW 開發技術。

使用 LabVIEW 設計、建置與分配獨立式應用，並套用單迴路與多迴路的設計樣式以發揮應用功能。

通過 LabVIEW 基礎認證 (CLAD) 即代表具備 LabVIEW 環境的實作知識，具備編碼與說明文件最佳實務的基礎概念，同時能了解與解譯現存程式碼。

將系統需求轉換為可擴充的軟體架構、針對程序間與網路架構的通訊選擇合適的方式、開發具可靠度的設計，並有效部署與複製您的嵌入式系統。

02

使用 CompactRIO 和
LabVIEW Real-Time
開發嵌入式應用
+
使用 CompactRIO 和
LabVIEW FPGA 開發嵌
入式應用
+
CLED 測驗¹

了解如何有效設計、進行原型製作並部署穩定的嵌入式控制與監控應用。

透過 LabVIEW FPGA 擴充 CompactRIO 系統的功能。

LabVIEW 嵌入式系統進階認證 (CLD) 證明通過認證測驗的開發人員有能力分析需求，也有能力設計、開發與部署穩定的關鍵業務嵌入式控制與監控應用，以及進行除錯。

¹CLED 測驗需要有效的 CLD 或 CLA 認證才能參加。

其他選項

- 使用 LabVIEW Real-Time 開發精確應用 (隨選課程)
- 使用 LabVIEW FGPA 開發客制化 FPGA 程式碼 (隨選課程)
- LabVIEW 核心課程 3
- CLD 測驗

開發自動化量產測試系統

此學習途徑適用於透過 LabVIEW+ 或 TestStand 建立製造測試或量產測試應用的工程師。同時提供相關課程、測驗與活動，可協助使用者於 TestStand 環境中開發實用的測試應用，並將之分配至測試工作站、針對硬體與受測裝置建立測試程式碼，以及將測試結果記錄至資料庫。

快速入門

針對 DUT 的個別元件建立程式碼模組或為測試站定義硬體連結的測試開發人員，應透過相關的教育訓練課程，熟悉程式設計環境與硬體功能。

01

LabVIEW 核心課程 1
+
硬體教育訓練
+
CLAD 測驗

透過實際操作方式，了解 LabVIEW 環境、資料流程式設計與常見的 LabVIEW 開發技術。

硬體教育訓練：透過豐富的教育訓練課程，了解 NI 硬體的安裝、設定與程式設計。

前往 learn.ni.com/catalog 觀看隨選的 PXI 教育訓練。

(非開發程式碼模組或使用文字式語言的使用者，可選擇是否採用此步驟。)



02

使用 TestStand 開發
測試程式
+
CTD 測驗

使用 TestStand 做為測試系統開發、執行、除錯自動化測試系統並管理、封裝與部署測試軟體的技術人員與測試系統設計人員。

使用 TestStand 開發、分析、部署實用的測試應用並進行除錯，以滿足您的測試需求。

通過 TestStand 進階認證 (CTD)，即代表有能力於 TestStand 軟體中開發、除錯並部署功能性應用，同時將開發時間縮至最短並確保可維護性。



03

使用 TestStand 架構
測試系統
+
CTA 測驗¹

測試軟體架構工程師會定義並建立測試組織的軟體架構，開發或選擇資料與使用者管理系統，並且開發可靠的客製化使用者介面。

設計並建構測試系統架構、學習進階功能，以及客製化 TestStand 的內建功能。

通過 TestStand 高階認證 (CTA) 即代表具備以 TestStand 建構高階測試系統的專業能力。

¹CTA 測驗需要有效的 CTD 認證才能參加。

其他選項

[InstrumentStudio 簡介](#)

[建立 InstrumentStudio 適用的量測外掛程式](#)

[LabVIEW 核心課程 2](#)

[使用 NI-DAQmx 與 LabVIEW 擷取資料](#)

[模組化儀器課程](#)

勳章評估

[TestStand 導覽與診斷](#)

[TestStand 序列開發](#)

[測試原理](#)

[測試儀器](#)

開發硬體迴路測試系統

此學習途徑適用於使用 VeriStand 或 HIL and Real-Time Test Software Suite 開發即時測試與硬體迴路應用的工程師，同時提供相關課程、測驗與活動，讓您了解如何使用 NI VeriStand 開發即時測試系統，以及建立可在執行階段進行編輯的使用者介面。

快速入門

無論您要建立如 HIL 模擬器與動力計的即時測試系統，或是要執行並修改現有 VeriStand 測試系統，均可了解測試開發與操作的基本原理。

01

使用 VeriStand 的 HIL
基本原理課程

使用 VeriStand 的現功能開發即時測試應用，例如硬體迴路測試系統。



02

LabVIEW 核心課程 1
+
使用 CompactRIO 和
LabVIEW Real-Time
開發嵌入式應用

了解如何利用 LabVIEW 的強大功能，為 VeriStand 新增更多功能。無論您是要建立客製化的即時邏輯、於 FPGA 上開發硬體演算法或重新設計使用者介面，LabVIEW 教育訓練課程均可提供實用的技巧，協助您為即時測試系統新增功能。

透過實際操作方式，了解 LabVIEW 環境、資料流程式設計與常見的 LabVIEW 開發技術。

了解如何有效設計、進行原型製作並部署穩定的嵌入式控制與監控應用。

其他選項

[汽車 HIL](#)

[SLSC 基本原理](#)

[LabVIEW 核心課程 2](#)

[LabVIEW 核心課程 3](#)

[使用 NI-DAQmx 與 LabVIEW 擷取資料](#)

[使用 CompactRIO 和 LabVIEW FPGA 開發嵌入式應用](#)

[使用 DIAdem 互動探索資料](#)

勳章評估

[LabVIEW 程式設計](#)

[DIAdem 資料探索](#)

電腦架構的資料擷取與資料記錄

此學習途徑適用於使用 NI DAQ 裝置與 LabVIEW 的工程師，以開發符合應用需求的客製化與自動化量測作業，並提供相關課程、測驗與活動，讓您了解如何設定硬體、執行精確的單點與連續量測，並同步化資料擷取作業。

快速入門

在初步了解 LabVIEW 環境、通訊機制與開發技巧之後，開發人員即可學習如何連接訊號，擷取、顯示與記錄量測結果，產生波形並選擇解析度與取樣率。

01

LabVIEW 核心課程 1
+
使用 NI-DAQmx 與
LabVIEW 擷取資料
+
LabVIEW 核心課程 2
+
CLAD 測驗

透過實際操作方式，了解 LabVIEW 環境、資料流程式設計與常見的 LabVIEW 開發技術。

透過感測器、NI 資料擷取硬體與 LabVIEW，了解資料擷取的基本原理。

使用 LabVIEW 設計、建置與分配獨立式應用，並套用單迴路與多迴路的設計樣式以達到應用功能。

通過 LabVIEW 基礎認證 (CLAD) 即代表具備 LabVIEW 環境的實作知識，具備編碼與說明文件最佳實務的基礎概念，同時能了解與解譯現有程式碼。



02

LabVIEW 核心課程 3
+
CLD 測驗

若要将資料擷取功能整合至大型應用或新增進階功能(例如同步化或處理大量資料)，則建議接受 LabVIEW 進階教育訓練。

了解架構完整的最佳實務，以設計、建置、記錄並測試 LabVIEW 應用。

進階認證測驗將驗證設計與開發功能性程式的能力，同時透過適當的說明文件與樣式，將開發時間縮至最短並確保可維護性。

其他選項

使用 FlexLogger 進行資料記錄

使用 DIAdem 互動探索資料

聲音測試基本原理

NI Audio and Acoustics Test Software 簡介

建議選項

PXI 系統設定與維護

PXI 時序與同步化

設定、擷取資料與維護您的 CompactDAQ 系統

勳章評估

進行實體量測

LabVIEW 程式設計

安裝、設定與控制 NI PXI 模組化儀器

這些隨選課程適用於使用 NI PXI 模組化儀器透過 NI InstrumentStudio™ 軟體以互動方式或透過 LabVIEW 以程式設計的方式，建立、產生、擷取並分析資料與訊號的工程師。了解完整的測試工作流程，包含設定、接線、控制、校準、除錯以及最佳化的速度與精確度。

快速入門

適用於 PXI 硬體系統的使用者。

01

PXI 系統設定與維護

探索 PXI 系統的元件，並了解如何安全地連接、設定與維護硬體並進行除錯。



適用於需要跨 PXI 硬體系統同步化作業的使用者。

02

PXI 時序與同步化

了解同步化的基本原理，以及可用來實作同步化方法的 NI 軟硬體工具。課程涵蓋混合訊號 DAQmx 同步化、訊號與外部參考架構的同步化，以及 NI-TCI 的高速同步化。

模組化儀器選項

控制測試應用的 NI 切換器

以 NI 多功能數位電錶進行量測

SMU 和電源供應器設定、控制和最佳化

使用 LCR 錶進行互動式測量

使用示波器進行測量

使用波型產生器產生訊號

運用 NI RF 技術進行 RF 訊號產生擷取與分析簡介

使用 Pulsed RF Measurement Library 測量功率增強效率

使用數位碼型產生器進行裝置測試

使用 DIAdem 管理資料

此學習途徑可協助工程師使用 DIAdem 迅速尋找、檢驗、分析量測資料並製作報告。同時提供相關課程、測驗與活動，讓您了解如何匯入、檢視並以圖形化的方式調查資料，自動產生報告並擴充 DIAdem 的功能。

快速入門

DIAdem 初階使用者可探索 DIAdem 環境中最重要的分析、報告製作與資料管理功能。若有興趣使用 DIAdem 環境擷取量測資料，建議可以參加 DIAdem Data Acquisition and Control (DAC) 課程。

01

使用 DIAdem 互動探索資料

了解如何使用 DIAdem 環境最重要的分析、報告製作與資料管理功能。



想要擴充 DIAdem 軟體功能的 DIAdem 使用者，請進一步探索 DIAdem 進階的 VBScript 與 SUDialog 功能。有意最佳化指令碼執行速度並盡可能減少維護作業的使用者，建議可以參加 DIAdem 客製化與資料管理課程。

02

使用 DIAdem 自動處理與自訂資料處理作業¹

使用 DIAdem 進階的 VBScript 與 SUDialog 功能，擴充 DIAdem 軟體的功能。

¹此課程提供 VBScript 與 Python 版本。

其他選項

使用 DIAdem 和 Python 自動處理與自訂資料處理作業¹

LabVIEW 核心課程 1

使用 NI-DAQmx 與 LabVIEW 擷取資料

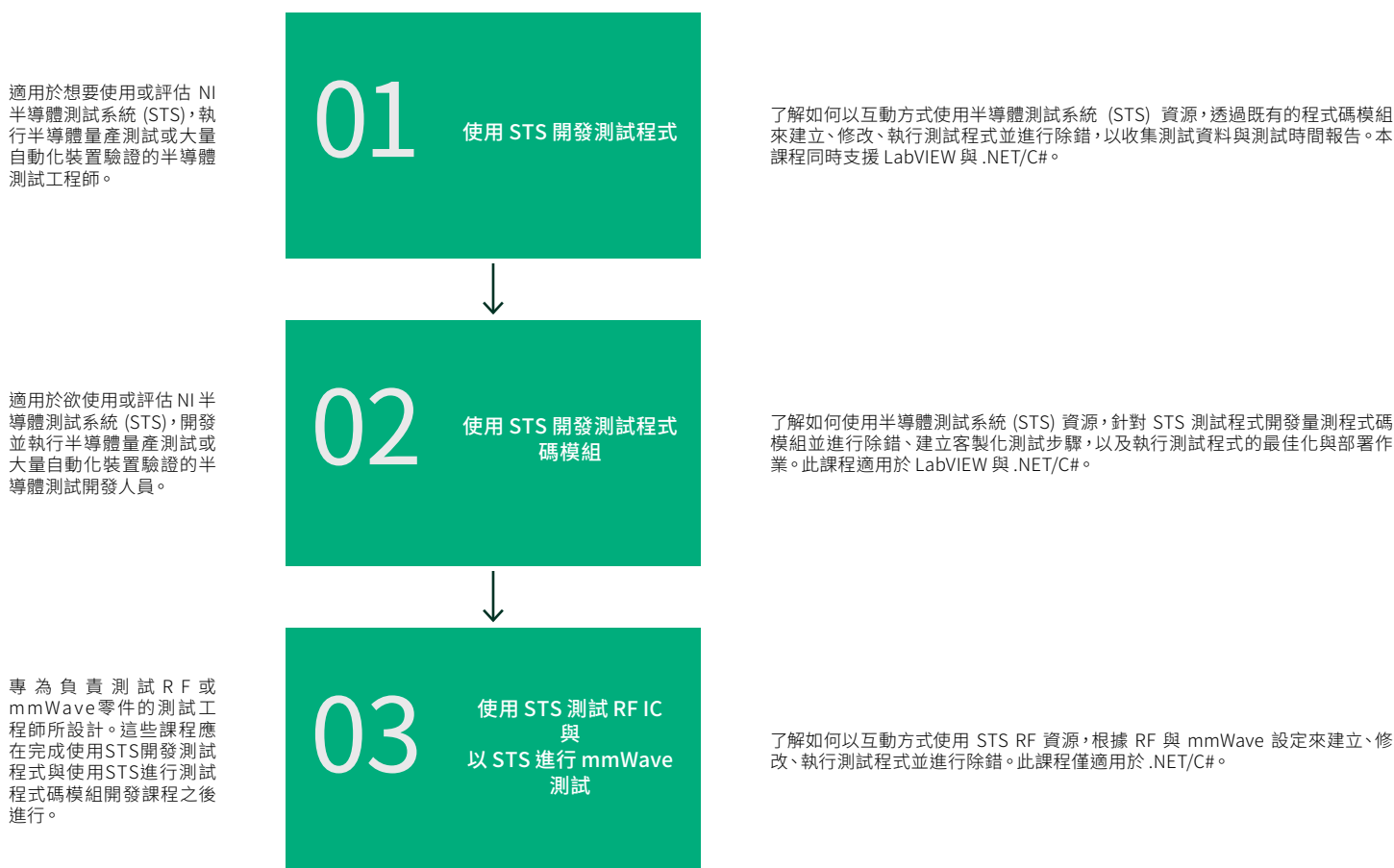
勳章評估

DIAdem 資料探索

半導體測試系統課程

半導體量產測試工程師往往必須在有限的時間與預算內，測試更複雜的零件。STS 測試工程師課程這項學習途徑包含 3 項專門設計的課程，讓半導體量產測試工程師快速了解如何使用 NI 半導體測試系統 (STS)，開發可設定的測試程式並除錯、建立客製化量測方式，並且針對混合訊號與 RF 裝置最佳化進階測試程式。

快速入門



其他選項 (適用於測試工程師)

使用數位模型產生器進行裝置測試

LabVIEW 核心課程 1

LabVIEW 核心課程 2

使用 TestStand 開發測試程式

其他選項 (適用於操作人員與技術人員)

STS 操作人員

STS 維護

透過 SystemLink 管理系統與資料

了解如何使用 SystemLink Enterprise 或 SystemLink Server 管理測試系統、部署軟體、管理硬體資產，以及收集與分析測試結果。

快速入門

推薦給想要有效管理、搜尋、存取與分析所有量測資料的使用者。



了解如何使用強大的SystemLink強大的視覺化與分析功能，有效監控及管理測試工作站系統狀態、軟體設定，以及測試結果。

本課程適用於 SystemLink Enterprise 或 SystemLink Server。

本課程提供課堂與虛擬教育訓練。

本課程將引導學員了解如何使用 Jupyter 常式自動載入檔案，以及如何與第三方資產交換資料。



使用 SystemLink API 與測試、系統和資產資料互動，從而延伸 SystemLink 功能並執行以客制分析支援且能發揮成效的控制介面。學員將有機會運用多種公用程式測試 SystemLink API 呼叫並進行除錯。

本課程適用於 SystemLink Enterprise 或 SystemLink Server。

本課程提供課堂與虛擬教育訓練。

其他選項 (適用於測試工程師)

使用 SystemLink Server 管理系統與資料 (僅提供隨選課程)

進階資料分析與 SystemLink Server 整合 (僅提供隨選課程)

使用 SystemLink Enterprise 進行系統監控、測試資料儲存與分 (僅提供隨選課程)

使用 DIAdem 互動探索資料

使用 TestStand 開發測試程式

其他選項 (適用於 IT)

安裝、監控與升級 SystemLink Server

安裝、監控與升級 SystemLink Enterprise

OptimalPlus 解決方案

OptimalPlus 使用者可以探索我們的應用程式運用大數據分析功能帶來的價值。

快速入門

適用於剛開始認識 NI OptimalPlus 解決方案的 OptimalPlus 新使用者。課程內容簡介 Portal+、Rules+ 與 Control Room+ 等應用程式的基本概念。

01

OptimalPlus 基礎知識
(適用於半導體)
或
OptimalPlus 基礎知識
(適用於非半導體)

熟悉 NI OptimalPlus 解決方案，因為課程內容簡介 Portal+、Rules+ 和 Control Room+ 等應用程式的基本概念。

本課程適用於半導體與非半導體解決方案。

適用於想要使用 Optimal+ Global Operations 解決方案駕馭大數據分析的強大功能，以完整掌握自身全球製造運作與流程，從而提高良率與生產力的對象。

02

OptimalPlus Global Operations：基礎內容
+
OptimalPlus Global Operations：進階內容

取得您全球製操作業與流程的整合式檢視。了解 Portal+ 與 Rule+ 應用的基本內容，包括於 Portal+ 上執行初步分析的方法。設定第一個控制介面與規則，建立自動化操作監控工具。本課程適用於半導體解決方案。

拓展 Portal+ 與 Rule+ 應用程式的基本技巧，並深入了解 Portal+。運用條件式格式與目標強化控制介面的視覺效果。建立客制查詢設定通用規則，並且跨實體類型偵測異常值。本課程適用於半導體解決方案。

在客戶環境中執行 Global Operations+，以及運用消除或降低異常單位的方式解決流程相關問題，並且提高品質與可靠性。

03

Escape Prevention 與
Escape Prevention
Advanced
+
使用 Outlier
Detection 解決方案
+
自適應測試時間縮短
與 NPI

執行防逃逸規則並分析資料，解決影響品質且導致測試逃逸的測試流程與操作問題。本課程適用於半導體解決方案。

了解如何使用預先定義的群體對測試資料執行異常值偵測演算法，然後在將規則套用於生產時，自動將單位切換成不同的分類表，藉此解決晶圓廠流程相關問題，從而滿足品質目標。本課程適用於半導體解決方案。

使用自適應測試模擬與新上市產品的進階功能，擴充 OptimalPlus 的功能。本課程適用於半導體解決方案。

其他選項 (適用於測試工程師)

Sequoia Essentials 課程概述

這一版 OptimalPlus Applications 的新功能

OptimalPlus「教師教育訓練」計畫

其他選項 (適用於 IT)

IT 基礎：Tier 1 入門 (半導體)

IT 基礎：Tier 1 入門 (非半導體)

靈活的購買選項

NI 提供多種教育訓練與專業認證服務，方便您靈活選擇。不論是要預先投資，或是想隨用隨付，NI 都有相關方案能符合您的預算需求。可至 ni.com/training/buy 購買大部分的課程，或透過 services@ni.com 聯絡 NI，以購買客製化或私人的教育訓練課程。

運用教育訓練會員資格節省經費

教育訓練會員資格提供具經濟效益的方式，方便您參加多種講師授課的教育訓練課程。本方案為期一年，供一名註冊使用者不限次數使用講師授課教育訓練與線上認證測驗。

先購買點數，再安排課程

立即選購教育訓練服務點數，日後即可用來兌換任何教育訓練或專業認證服務。教育訓練服務點數有效期限為一年。

報名參加公開課程

查看 [NI 的全球教育訓練行事曆](#)，並報名參加即將到來的虛擬或現場講師授課課程。您可以填寫[此表格](#)報名課程。

妥善利用隨選學習功能

NI 軟體授權可讓您在一年內存取入門隨選學習內容，以便您快速進入狀況。前往 ni.com/training/buy 購買額外的隨選課程。

若要了解自己的授權包含哪些隨選教育訓練，可參閱知識庫文章「[基於我的 NI 服務合約，我可以參加哪些線上訓練課程？](#)」。

舉辦私人教育訓練活動

NI 提供私人教育訓練活動，參加學員最多 12 名。私人教育訓練活動可以標準的 NI 教育訓練課程內容為主，再根據您的需求加入量身訂製的客制化教材。您可以填寫[此表格](#)申請私人教育訓練。



探索 NI 學習中心

NI 學習中心提供數百種隨選課程與應用導向的學習途徑，可讓您輕鬆快速地學習新技能。

立刻前往 learn.ni.com 查看相關資訊。



先投資後使用

NI 提供 2 種選項，可讓客戶預先付費以取得教育訓練與專業認證。NI 提供教育訓練會員方案，適用於想要預先付費以不限次數參加講師授課教育訓練與專業認證的個人。個人與團隊經理均可購買大量的教育服務點數，並於購買後的一年內兌換任何教育服務項目。

教育服務點數

教育服務點數是專為個人或團體所設計，可為多位員工或團隊成員購買教育訓練課程，並可另外決定受訓者與受訓時間。您可以使用點數購買：

- 虛擬或課堂形式的講師授課教育訓練課程 (公開/私人)
- 隨選教育訓練
- 認證

點數適用於大型專案、大量授權協定，或是年終預算採購。請前往 ni.com/training 以取得更多教育服務點數的相關資訊。

教育訓練會員資格

教育訓練會員資格可不限次數參加所有的 NI 公開課堂與公開虛擬課程，以及不限次數的認證優惠券。如果您打算在一年內參加多個講師授課課程，如此即可節省成本。教育訓練會員資格為不續約的單次購買。請前往 ni.com 取得更多教育訓練會員資格的相關資訊。

學習形式

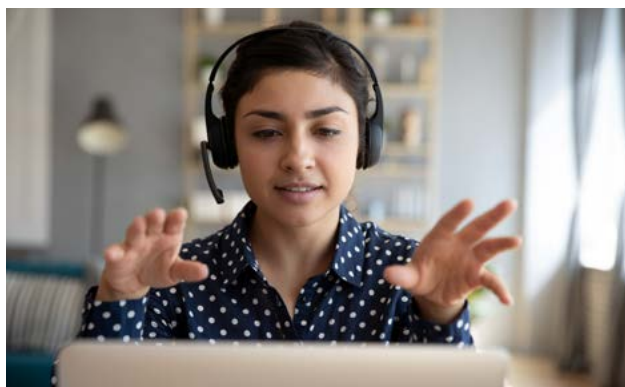
透過我們的學習方案，您可以掌控自己接受教育訓練的方式同時滿足自己的學習偏好。

NI提供多種語言與形式的課程，包含全球各地的教育訓練中心授課或外派授課、隨選課程，以及符合個人需求的虛擬教育訓練。不論選擇哪一種課程形式，NI教育訓練課程都有助於立即提高生產力並逐步達成長期目標。請前往 ni.com/training/options 以進一步了解學習形式。



排定時程的課堂教育訓練

將日常工作的干擾拋諸腦後，並實際操作軟硬體、與經驗豐富的教師進行面對面互動，並與同儕及同事討論想法與問題。



排定時程的虛擬教育訓練

盡可能省下差旅成本，並將對自身排程的衝擊降到最低，同時享有即時教學的優勢。NI講師會使用虛擬課堂環境來呈現學習教材，而您可以透過虛擬機器或遠端系統，在桌面上完成課程練習。



隨選教育訓練

NI了解您可能因為時間有限或缺乏相關資源，而無法參與教師授課的教育訓練方案。隨選教育訓練是具經濟效益的替代方案，只要使用您的 ni.com 個人檔案資訊，即可透過 learn.ni.com 全天候存取隨選教育訓練。

比較不同的學習形式

NI 提供多種形式的

比較不同的學習形式

NI 提供多種形式的教育訓練課程，包含講師授課與自學課程，可滿足您的學習偏好。

學習形式	說明	教育服務點數 (ESC) 或 EA Flex 點數 (FC)	舊版教育訓練點數 (TC)
隨選	線上課程包含預先錄製的影片、示範與測驗。 提供為期 12 個月的租用版。	單次租用 5 ESC 或 FC	單次租用 2 TC
公開課堂	列於行事曆上且歡迎公眾報名的教育訓練課程，會於實體 NI 教育訓練中心進行授課。 授課時間為一整天 (8 小時)。	一名學生每天 10 ESC 或 FC	一名學生每天 3 TC
公開虛擬*	列於行事曆上且歡迎公眾報名的教育訓練課程，會以虛擬形式授課。	一名學生每天 8 ESC 或 FC	一名學生每天約 2.5 TC
私人課堂	針對特定使用者群組所舉辦的教育訓練課程， 通常於客戶所在地進行。 授課時間為一整天 (8 小時)。	每天 70 ESC 或 FC/最多 12 名學生	每天 20 TC/最多 12 名學生
私人虛擬*	針對特定使用者群組所舉辦的虛擬教育訓練課程。 授課時間為半天 (4 至 6 小時)。	軟體： 每天 56 ESC 或 FC/最多 12 名學生	軟體： 每天 17 TC/最多 12 名學生
		硬體： 每天 32 ESC 或 FC/ 最多 6 名學生 ¹ ¹硬體架構的私人虛擬課程最多可容納 6 名學生， 確保客戶享有絕佳的教學體驗。	硬體： 每天 10 TC/最多 6 名學生 ¹
私人課堂配置	以私人課堂的形式進行授課，並使用經過重新配置的 NI 標準教育訓練內容，更能滿足學員的需求。 授課時間為一整天 (8 小時)。	每天 84 ESC 或 FC/ 最多 12 名學生	每天 25 TC/最多 12 名學生
私人虛擬配置	以私人的虛擬形式進行授課，並使用經過重新配置的 NI 標準教育訓練內容，更能滿足學員的需求。 授課時間為半天 (4 至 6 小時)。	每天 67 ESC 或 FC/最多 12 名學生	每天 20 TC/最多 12 名學生

*虛擬講師授課的教育訓練有一些例外情況，請前往 ni.com 了解最終價格。

私人課堂或虛擬教育訓練

如果貴公司有多名員工需要培養技能，以便有效使用 NI 產品，那麼私人課堂或虛擬教育訓練會是極具經濟效益的解決方案。私人課堂或虛擬教育課程可於貴公司的設施提供課堂學習體驗，替您省下差旅費用。此外也可讓您專注於重要主題或團隊的挑戰上。

如需深入了解，請透過 services@ni.com 聯絡 NI。

教育服務課程

參加 NI 教育訓練課程以熟悉 NI 軟硬體。

教育服務課程會採用現場授課、虛擬課堂、實驗室以及協同合作工作階段等形式，提供初階與進階使用者都適用的內容。課程主題涵蓋使用 LabVIEW、TestStand、VeriStand、FPGA 與資料擷取硬體等領域。

講師授課的教育訓練課程

專業能力：

進階中階入門

標準課程	講師授課學習形式				講師授課學習形式			
	教育服務點數 (ESC) 或 EA Flex 點數 (FC)				課程長度 (天)			
	公開課堂	私人課堂	公開虛擬	私人虛擬	公開課堂	私人課堂	公開虛擬	私人虛擬
LabVIEW 的行動元件導向設計	30	210	24	168	3	3	4	4
使用 TestStand 架構測試系統	20	140	16	112	2	2	3	3
使用 DIAdem (原 DIAdem Advanced) 自動處理與自訂資料處理作業	20	140	16	112	2	2	3	3
使用 DIAdem 和 Python 自動處理與自訂資料處理作業	20	140	16	112	2	2	3	3
使用 NI-DAQmx 與 LabVIEW 擷取資料	20	140	16	112	2	2	3	3
使用 CompactRIO 和 LabVIEW FPGA 開發嵌入式應用	30	210	24	96	3	3	4	4
使用 CompactRIO 和 LabVIEW Real-Time 開發嵌入式應用	40	280	32	128	4	4	5	5
使用 TestStand 開發測試程式	30	210	24	168	3	3	4	4
使用 DIAdem (原 DIAdem Basics) 進行互動式資料探索	30	210	24	168	3	3	4	4
使用 VeriStand 的 HIL 基本原理課程	30	210	24	96	3	3	4	4
安裝、監控與升級 SystemLink Server	20	140	16	112	2	2	3	3
LabVIEW 核心課程 1	30	210	24	168	3	3	5	5
LabVIEW 核心課程 2	20	140	16	112	2	2	3	3
LabVIEW 核心課程 3	30	210	24	168	3	3	4	4
LabWindows/CVI 核心課程 1	30	210	24	168	3	3	4	4
LabWindows/CVI 核心課程 2	20	140	16	112	2	2	3	3
使用 SystemLink Server 管理系統與資產	10	70	8	56	1	1	2	2
使用 SystemLink Enterprise 管理系統與資產	不適用	70	不適用	56	不適用	1	不適用	2
LabVIEW 中的物件導向設計與程式設計	30	210	24	168	3	3	4	4

標準課程	講師授課學習形式				講師授課學習形式			
	教育服務點數 (ESC) 或 EA Flex 點數 (FC)				課程長度 (天)			
	公開課堂	私人課堂	公開虛擬	私人虛擬	公開課堂	私人課堂	公開虛擬	私人虛擬
SystemLink Server Advanced：擷取、管理與視覺呈現測試資料	10	70	8	56	1	1	2	2
SystemLink Enterprise Advanced：擷取、管理與視覺呈現測試資料	不適用	70	不適用	56	不適用	1	不適用	2
使用 STS 和 LabVIEW 開發測試程式碼模組	30	210	16	64	3	3	4	4
使用 STS 和 .NET/C# 開發測試程式碼模組	20	140	16	64	2	2	3	3
使用 STS 開發測試程式	30	210	24	96	3	3	4	4
自適應測試時間縮短與 NPI	欲了解價格和課程時間長度，請聯絡 services@ni.com 。							
Calibration Executive								
Escape Prevention 與 Escape Prevention Advanced								
安裝、監控與升級 SystemLink Enterprise								
IT 基礎：適用於 OptimalPlus 的 Tier 1 入門								
OptimalPlus Global Operations：基礎內容								
OptimalPlus Global Operations：進階內容								
OptimalPlus「講師教育訓練」計畫								
Sequoia 基本概念								
STS 操作人員								
STS 維護								
使用 Outlier Detection 解決方案								
這一版 OptimalPlus Applications 的新功能								

主要用於企業協定 (EA) 中的舊版教育訓練點數 (TC)，會有特定的數量。若需相關細節，請參閱[此處](#)。

隨選學習課程

課程名稱	教育服務點數 (ESC) 或 EA Flex 點數 (FC)
聲音測試基本原理	免費
使用 TestStand 架構測試系統	5
進階資料分析與 SystemLink Server 整合	5
使用 DIAdem (原 DIAdem Advanced) 自動處理與自訂資料處理作業	5
使用 Vehicle Communication Toolkit 進行汽車通訊	5
使用 NI-XNET 進行汽車通訊	5
汽車 HIL	5
BTS 測試站配置與測試開發	免費
電池測試系統安全與維護流程	免費
控制測試應用的 NI 切換器	5
課程更新與新功能：LabVIEW 2024 Q3	免費
課程更新與新功能：VeriStand 2024 版	免費
使用 monoDrive 建立自動化車輛模擬	免費
建立 InstrumentStudio 適用的量測外掛程式	免費
使用 G Web Development Software 建立網路應用	5
使用 NI-DAQmx 與 LabVIEW 擷取資料	5
Data Record AD 系統配置與設定	5
使用 FlexLogger 進行資料記錄	免費
使用 LabVIEW FPGA 開發客制化 FPGA 程式碼	5
使用 LabVIEW Real-Time 開發精確應用	5
使用 VBAI 開發機器視覺系統	5
使用 TestStand 開發測試程式	5
使用數位碼型產生器進行裝置測試	5
ECU 測試系統安全與維護流程	5
使用 DIAdem (原 DIAdem Basics) 進行互動式資料探索	5
使用波型產生器產生訊號	5
使用 VeriStand 的 HIL 基本原理課程	5
整合 NI VCSEL I-V 測試子系統	5
InstrumentStudio 簡介	免費
MeasurementLink™ 簡介	免費
NI Audio and Acoustics Test Software 簡介	免費
運用 NI RF 技術進行 RF 訊號產生擷取與分析簡介	免費
逆變器 HIL 測試系統教育訓練	5
LabVIEW 網路連結	5
LabVIEW 核心課程 1	5
LabVIEW 核心課程 2	5
LabVIEW 核心課程 3	5
LabVIEW 互通性	5

課程名稱	教育服務點數 (ESC) 或 EA Flex 點數 (FC)
LabWindows/CVI 核心課程 1	5
使用 Pulsed RF Measurement Library 測量功率增強效率	免費
量測晶圓級穩定性	5
使用 STS (.NET/C#) 測試 mmWave (原先為使用 STS 測試 mmWave)	5
Multisim 基本課程	5
LabVIEW 中的物件導向設計與程式設計	5
OptimalPlus 基礎知識 (半導體與非半導體)	僅限購買軟體的使用者
PAtools 基礎與概述	免費
PXI 系統設定與維護 (原 PXI 系統設定)	5
PXI 時序與同步化	5
使用 STS 與 NET/C# 測試 RFIC (原先為使用 STS 測試 RFIC)	5
適用於 RF 前端設計驗證的 RFIC 測試	免費
適用於 DUT 驗證的半導體裝置控制外掛程式	免費
設定、擷取資料與維護您的 CompactDAQ 系統	5
SLSC 基本原理	5
SMU 和電源供應器設定、控制和最佳化	5
適用於測試應用的軟體工程	5
使用 NIVLM 進行軟體授權管理	免費
使用 LCR 錶進行互動式測量	5
以 NI 多功能數位電錶進行量測	5
使用示波器進行測量	5
使用 STS 開發測試程式碼模組	5
使用 STS 開發測試程式	5
Ultiboard 基本概念	5
SDR 應用：使用開放原始碼工具與 USRP 硬體	免費
使用 SystemLink 軟體管理系統與資料	免費

透過 NI 勳章加速學習並提升您的成就。

尋找學習資源並獲得與應用相關的技能。透過里程碑勳章評估與專業認證，追蹤自己的知識成長情形。並透過社交媒體與求職網站與他人分享自己的成功經驗。

什麼是勳章？

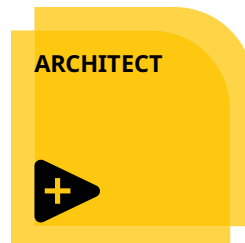
勳章是NI頒發給您的數位憑證以表揚您的成就，例如通過評估、測驗或稽核。這些數位憑證包含經過驗證的個人化資訊，包括您為取得認證所通過的測驗，或您在應用領域中通過測試的技能。

NI 勳章



學習勳章

透過隨選學習了解工程基本原理與 NI 產品最佳實務，接著透過自我評估檢驗自己的理解程度，並分享您的成功經驗。



專業認證

證明自己具備必要技能，可透過 NI 軟體建立高品質應用。在社交媒體與求職網站分享自己的技能，並提升自己的職涯發展。



社群宣傳

在 NI 使用者社群與 NI 廣大的工具與專業開發人員生態系統中，發揮技術領導能力、參與並做出貢獻以獲得肯定。

提升您的成就

您可以透過超連結，將勳章影像檔案轉成包含您經過驗證的專屬資料之數位憑證。這種方式相較於書面證明更為安全，並可避免他人盜取您的憑證。把超連結的勳章影像加入電子郵件簽名，並在社交媒體與求職網站分享您的勳章，能有效地讓您的職場人脈知道您的成就。

勳章優點

雇主、同事和客戶都可以透過勳章立即檢驗您的技能，因此您可以針對自己的學習情況徵求意見，並了解自己未來的技能發展。此外，您也可以藉由勳章在各種社交媒體平台上輕鬆分享自己的成就。有任何疑問嗎？請發送電子郵件至 services@ni.com。

透過 NI 學習勳章挑戰自己並檢驗自己的理解程度。

透過學習勳章自我評估，可讓 NI 課程與專業認證更進一步讓您了解自己的知識成長情形，並找到與應用相關的更多內容。利用這些免費的線上評估，檢驗自己對使用 NI 產品的工程基本原理與最佳實務的理解程度。學習勳章的用途：

- 準備 NI 認證測驗。
- 在開始新專案之前先找出需要加強的知識。
- 最佳化您的自學課程，並根據您的需求選擇特定主題。

學習勳章的作用：

1. 選擇與您專案相關的勳章並查看可用的學習資源。
2. 參加不受時間限制的免費開卷式評估。
3. 取得勳章學習途徑中的所有勳章，並獲得該途徑的高階勳章。
4. 按照 Credly 的指示，在社交媒體和求職網站與其他人分享您的勳章。

選擇最符合應用需求的勳章學習途徑



自動化簡單的工作項目，並執行一次性的基本量測作業。從頭建立簡單的迴圈或定序器 VI。



使用 LabVIEW 與 NI 資料擷取硬體，進行臨時工程量測。建立客製化的量測解決方案，以擷取並呈現實際訊號。



建立測試與量測原理的基礎，以協助您使用測試平台測試多種產品。

前往 ni.com/badges 即可參加免費的學習勳章評估。

透過專業認證檢驗您的技能並提升自己的職涯。

專業認證代表您具備運用 NI 軟體建立高品質應用的技能，並讓客戶、同事與雇主對您的能力充滿信心。NI 提供全球標準化的專業認證，可跨團隊、組織或國家進行安全且一致的測試。您可以使用專業認證來評估並檢驗個人的技能，以便安排專案人員或職涯發展。

CLAD | LabVIEW 基礎認證 (CLAD)

CLAD 認證代表您對 LabVIEW 環境具有廣泛的應用知識、基本了解編碼與說明文件的最佳實務，同時能夠判讀並解譯現有的程式碼。

CLD | LabVIEW 進階認證 (CLD)

CLD 認證代表您能夠設計與開發功能性程式，同時透過適當的說明文件與樣式，將開發時間縮至最短並確保可維護性。

CLA | LabVIEW 高階認證 (CLA)

CLA 測驗將測試使用者建立合理 VI 階層與專案計畫的能力，確認是否能提供符合專案需求的應用。通過高階認證的工程師能夠自行設計應用架構，並管理其他工程師的個別元件開發作業。

CLED | LabVIEW 嵌入式系統進階認證 (CLED)

CLED 代表您具備以 CompactRIO、單卡式 RIO 與/或 R 系列硬體為架構，進行設計、開發、除錯與部署應用的專業

能力。CLED 可有效使用 LabVIEW Real-Time 與 LabVIEW FPGA Module 搭配 NI 建議的最佳實務，設計出符合各種需求的模組化、可擴充且易於維護的嵌入式系統。

CTD | TestStand 進階認證 (CTD)

CTD 是 TestStand 認證流程的第一步 (共 2 個部分)，可檢驗人員是否能在 TestStand 軟體中開發、除錯並部署功能性應用，同時盡可能縮短開發時間並確保可維護性。

CTA | TestStand 高階認證 (CTA)

CTA 是 TestStand 認證流程的第二步。CTA 展現出使用者根據高階規格在 TestStand 中建構測試系統的專業能力。通過高階認證的工程師能夠自行設計應用架構，並管理其他工程師的個別元件開發作業。

CPI | 專業講師認證 (CPI)

CPI 認證代表獲得 NI 課程教學授權的人員。CPI 是唯一獲得授權可教授 NI 課程的非 NI 講師。CPI 可透過教學課程找出商機，並成為該領域的專家。

專業認證測驗形式	複選題	實作	必備條件	測驗時間	認證展期期間	教育訓練服務點數
LabVIEW 基礎認證 (CLAD)	■		無	1 小時	2 年	1
LabVIEW 進階認證 (CLD)		■	無	4 小時	3 年	3
LabVIEW 高階認證 (CLA)		■	CLD	4 小時	4 年	3
LabVIEW 嵌入式系統進階認證 (CLED)	■	■	CLD 或 CLA	1 小時 + 5 小時	5 年	1 + 3
TestStand 進階認證 (CTD)		■	無	4 小時	3 年	3
TestStand 高階認證 (CTA)	■		CTD	1 小時	4 年	1
專業講師認證 (CPI)		■	CLD/CTD 或以上	8 小時	以合約為準	不適用

準備測驗

透過準備指南、網路直播、模擬試題與解答等資源，即可輕鬆準備測驗。請至 ni.com/certification-prep 選擇您感興趣的測驗，以查看準備指南。

報名 NI 的任一免費專業認證準備課程。

參閱 NI 的 [全球教育訓練行事曆](#)，以選擇日期。

報名測驗

準備好參加測驗了嗎？從這裡開始：

1. 前往 [NI 認證方案](#) 或 [NI 學員控制介面](#) 以開始。
2. 詳閱 [NI 認證方案](#) 內容並選擇您感興趣的測驗。
3. 確認您已符合參加相關測驗的必備條件。
4. 如需現場測驗日期，請參閱 NI 的 [全球教育訓練行事曆](#)。
5. 將您的需求傳送至 services@ni.com 或填寫 [此表格](#)。

認證展期

如需深入了解我們的認證展期政策與流程，請造訪 ni.com。

還沒準備好參加測驗嗎？

如果您想要花更多時間了解測驗主題，請探索 NI 勳章計畫。透過 NI 勳章評估了解自己的技能水平，並在取得勳章的過程中查看推薦的學習教材。

請前往 ni.com/badges 深入了解。

NI 全球服務與支援

NI 擁有領先業界的產品，並在世界各地皆有專家提供豐富的服務項目，可協助您達成目標。不論您的挑戰是簡單還是複雜，NI 都可以透過教育訓練、技術支援、諮詢、整合與硬體服務，協助您充分發揮生產力並降低成本。

NI 的員工都富有創造力並善於解決問題，且隨時樂於協助他人提高工作效率。如果您覺得我們能協助您調整符合需求的學習途徑，歡迎隨時與我們聯絡。

軟體服務

透過技術支援、線上教育訓練、靈活授權與資產管理等服務，充分發揮 NI 軟體的效能。

硬體服務

透過世界級的硬體服務方案，大幅縮短停機時間、節省維修成本並確保量測準確度。

教育服務

透過 NI 教育訓練課程即可提升 50% 的開發速度，並縮短 43% 的程式碼維護時間。此外，還可透過 NI 專業認證檢驗您的專業能力。

技術支援服務

透過電話或電子郵件聯絡 NI 應用工程師，即可迅速開始使用 NI 產品或解決疑難雜症。

專業服務

利用廣大的 NI 合作夥伴與 NI 工程師網路，可協助您進行原型製作、可行性分析、諮詢與系統整合。

技術資源

前往 ni.com 取得豐富的自助資訊，包含應用訣竅、範例程式與開發社群。

逐步邁向成功

不論是規劃、開發、部署或後續維護等應用生命週期的任何階段，都可以妥善利用符合您需求的相關服務。

- 專業的技術支援
- 線上與課堂教育訓練課程
- 軟體升級與更新
- 硬體維修與校準
- 系統組裝與測試
- 原型製作與可行性分析
- 諮詢與開發協助

身心障礙與無障礙

我們與眾人攜手合作！NI 致力於盡可能讓所有人都能參與教育訓練課程，無論其技術或能力為何。

Emerson、Emerson Automation Solutions 或其任何附屬實體，均不對任何產品的選用、使用或維護負責。購買者與終端使用者應自行負責選用、使用與維護任何產品。

NI、National Instruments、National Instruments 企業標誌、ni.com、LabVIEW、TestStand、VeriStand、SystemLink、CompactRIO 與 NI-DAQmx 均為 Emerson Electric Co. 旗下其中一家測試與量測業務單位所擁有的商標。Emerson 與 Emerson 標誌為 Emerson Electric Co. 的商標與服務商標。LabWindows 商標經過 Microsoft Corporation 授權使用。Windows 是 Microsoft Corporation 在美國與其他國家/地區的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。NI 合作夥伴是獨立於 NI 的事業體，與 NI 之間並無任何代理或合資關係，也不具任何商業合作關係。

本出版品的內容僅供參考之用，儘管我們已盡可能確保其準確度，這並不構成對本出版品所述產品或服務或其用途或適用性的擔保或保證（無論明示或暗示）。所有銷售均受 NI 的條款與條件約束，而條款和條件會應要求提供。NI 保留修改或改善這類產品之設計或規格的權利，如有變更，恕不另行通知。

NI
11500 N Mopac Expwy
Austin, TX 78759-3504

© 2025 National Instruments. 保留所有權利。 604200

ni.com
ni.com/services